Что касается слагаемого $i_1(t)$ (2), его влияние может быть устранено оптимальным выбором времени окончания импульса из **VCЛОВИЯ**

$$\sin(\omega t + \Theta) = \frac{e^{-\frac{t}{RC}}}{RC \sqrt{\frac{1}{(RC)^2 + \omega^2}}}$$
(5)

Реализация генератора видеоимпульсов в лаборатории «Авиационные подшипники» позволила исследовать реологические свойства жидкостей при давлениях до 6000 кгс/см².

ЛИТЕРАТУРА

1. Мэзон У. Пьезоэлектрические кристаллы и их применения в ультрааку-

стике. И. Л. Москва, 1952. 2. Степичев А. А., Кремлевский В. П. Вибрационный вискозиметр. Авторское свидетельство. СССР, кл 42е, 7/02, № 221989.

н. а. кшнякин

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ДВУХ АМПЛИТУД

Для исследования вязкости жидкостей в качестве датчика применяются крутильно-колеблющиеся кварцевые резонаторы. Датчик периодически возбуждается импульсным генератором, а в паузе между импульсами совершает свободные колебания. Развиваемое датчиком напряжение может быть записано в виде:

$$U_{(t)} = U_m \, e^{-\alpha t} \sin \omega_{ct},\tag{1}$$

где ω_c — собственная угловая частота датчика;

α — постоянная затухания, зависящая от параметров датчика и вязкости окружающей его среды.

Вязкость среды, по известной методике, может быть вычислена по осциллограммам переходного процесса (1), что является трудоемким процессом, а точность его низкая. В [1] описан вискозиметр, реализующий принцип измерения α по временному интервалу, разделяющему моменты равенства входного напряжения вида $U_m e^{-\alpha t}$ с двумя различными опорными напряжениями.

Для этой цели в (1) необходимо выделить огибающую $U_m e^{-\alpha t}$, однако с увеличением вязкости (давления) добротность резонатора уменьшается и детектирование сопровождается возрастающей погрешностью.

Повышение точности измерения вязкости высоковязких сред, а также жидкостей, находящихся под высоким давлением, может быть осуществлено с помощью амилитудно-временного преобразо-



Рис. 1. Блок-схема устройства для измерения вязкости

вателя (АВП) формирующего прямоугольный импульс, длительность которого пропорциональна амплитуде входного напряжения, блок-схема устройства для измерения вязкости приведена на рис. 1.

Генератор радиоимпульсов I периодически возбуждает датчик 2 (кварцевый или магнитострикционный). В паузе между импульсами датчик совершает свободные колебания, а напряжение, снимаемое с датчика, усиливается усилителем 3. Выходное напряжение с усилителя поступает на ключи 4, 6 и блок управления 5. Блок управления формирует из входного напряжения два импульса, сдвинутых на время, кратное периоду (1). Импульсы управляют ключами 4 и 6, а их длительность нормализована и равна 1/2 периода входного напряжения. В момент времени, соответствующий началу первого положительного полупериода импульсом с блока управления 5, открывается ключ 4, пропуская на вход АВП (7) напряжение с усилителя 3, второй импульс открывает ключ 6 и на вход АВП (8) поступает вторая положительная полуволна (1). Длительность импульсов измеряется частотомерами 9 и 10.

Точность измерения амплитудного значения импульсов с помощью АВП, эквивалентная схема которого приведена на рис. 2*a*, зависит от величины недозаряда запоминающего конденсатора и временного запаздывания начала разряда конденсатора относительно максимального значения входного импульса.

Для прямоугольного и экспоненциального импульсов погрешность недозаряда конденсатора вычислена в [2], однако зависимость тока зарядного устройства справедлива и для импульсов синусоидальной формы:

$$i(t) = \frac{I_0 e^{\frac{I_0 t}{\varphi_{\rm T} C}} e^{\frac{U_m}{\varphi_{\rm T}} \sin \omega_c t}}{1 + \frac{I_0}{\varphi_{\rm T} C} \int_0^t e^{\frac{1}{\varphi_{\rm T}} \left[U_m \sin \omega_c \xi + \frac{I_c \xi}{C} \right]} d\xi}$$
(2)

Расчет величины тока проведен на ЭВМ, а величина недозаряда может быть определена по формуле (2-64 б) в [3].

$$U_g = \varphi_{\tau} \ln \left(\frac{I}{I_0} + 1 \right) + I_{r\delta} \tag{3}$$

33



Рис. 2. а — эквивалентная схема; б — характеристики прибора

Погрешность АВП, вычисленная по формулам (2) и (3), существенна для малых входных напряжений (50 *мв*) и увеличивается с уменьшением длительности входного импульса. На частоте 5.10⁵ гц величина недозаряда составляет 17,3.10⁻³ в, а при частоте 10⁵ гц всего 3.10⁻³в, и если амплитуда входного импульса превышает 2в, погрешность недозаряда менее 0,5% для частоты 2.10⁵ гц (датчиками на большие частоты лаборатория не располагает).

Временное запаздывание начала линейного разряда конденсатора для импульсов, получаемых на выходе ядерных детекторов, рассмотрено в [4] в предположении, что дискриминатор тока, включенный в цепи зарядного устройства, формирует импульс при уменьшении зарядного тока до нуля. Однако в момент максимума входного напряжения ток запоминающего конденсатора равен нулю, а ток зарядного устройства равен току разряда J_0 (см. рис. 26) и лишь в момент времени T_1 уменьшается до нуля, что приводит к погрешности преобразования. Начало линейного разряда конденсатора определим для полуволны синусоидального колебания, для эквивалентной схемы АВП, приведенной на рис. 2a

$$i_{s,y}(t) = i_c(t) + I_0$$
(4)

Учитывая, что $U_c(t) = U_m e^{-\alpha t} \sin \omega_c t = U_m f(t)$, $i_c(t)|_t = T_M = 0$ разложим (4) в ряд Тейлора в окрестности T_M , соответствующей максимуму входного напряжения

$$i(t) = i_c(T_M) + \frac{T_1 - T_M}{1!} i'_c(t_M) + \frac{(T_1 - T_M)^2}{2!} i''(t_M) + \dots$$
(5)

Принимая во внимание

$$i(t)|_{t} = T_{M} = I_{0}, \quad i_{c}(t) = c \frac{du_{c}}{dt} = CU_{m} f'_{(t)}$$

$$T_{1} - T_{M} = -\frac{f''(T_{M})}{f'''(T_{M})} \pm \sqrt{\left[\frac{f''(T_{M})}{f'''(T_{M})}\right]^{2} - \frac{2I_{0}}{CU_{m} f''_{(T_{M})}}}$$

34

Ввиду того, что
$$\left[\frac{f''(T_{\rm M})}{f'''(T_{\rm M})}\right]^2 \gg \frac{2I_0}{CU_m f_{(T_{\rm M})}''},$$

а отрицательное значение корня не имеет физического смысла:

$$T_{1} - T_{M} = \frac{I_{0}}{CU_{m}f_{(T_{M})}^{''}}$$
(6)

За время Т1-Тм, когда зарядное устройство открыто, запоминающий конденсатор С₃ теряет часть заряда и линейный разряд начинается с меньшего напряжения на величину

$$\Delta U = -\frac{1}{C} \int_{T_{\rm M}}^{T_{\rm L}} [i(t) - I_0] dt.$$
(7)

После интегрирования с учетом (5) и (6) имеем:

$$\Delta U = -\frac{1}{2} \left(\frac{I_0}{C} \right)^2 \frac{1}{U_m f'_{(T_M)}} \left\{ \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \left(\frac{I_0}{C} \right) \frac{f_{(T_M)}}{U_m \left[f'_{(T_M)} \right]^2} \right\}.$$
 (8)

Относительная погрешность

$$\delta U = \frac{d(\Delta u)}{dU_m} = -\left(\frac{I_0}{C}\right)^2 \cdot \frac{1}{2U_m^2 f_{(T_M)}^n} = -\left(\frac{I_0}{C}\right)^2 \frac{1}{2U_m^2 e^{-\alpha t} \left(\alpha^2 + \omega_c^2\right)}.$$
 (9)

Для схемы АВП с дискриминатором в цепи запоминающего конденсатора эта погрешность меньше и зависит от порога срабатывания дискриминатора. Преобразованные АВП мгновенные значения двух амплитуд по известной методике используются для вычисления коэффициента затухания α н, как следует из вышеизложенного, с большей точностью по сравнению с известными способами. Цифровые эквиваленты мгновенных значений 2-х амплитуд могут быть введены в ЭВМ для оперативной обработки результатов эксперимента.

ЛПТЕРАТУРА

1. Степичев А. А., Кремлевский В. П. Авторское свидетельство № 221989, кл. 42е, 7/02.

2. Горн Л. С. Хазанов Б. И. О погрешности заряда конденсатора в ана-логовых схемах памяти. Радиотехника и электроника № 3, 527, 1963.

3. Степаненко И. П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем.

Москва «Энергия», 1967. 4. Szavits O. «Analog-to-digital converter nonlinearity due to the loss current.» «Nuclear Instruments and methods» 39 (1966) p. p. 239–296. Northholland publishing co.